Organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung und Herstellungsverfahren dazu

5

10

15

Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgelöster Strukturierung, insbesondere einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET) mit kleinem Source-Drain-Abstand und ein massenfertigungstaugliches Herstellungsverfahren dazu.

Die Schaltfrequenz und/oder die Schaltgeschwindigkeit integrierter digitaler Schaltungen wird nicht zuletzt von der Kanallänge "l" maßgeblich beeinflusst. Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, diese Kanallänge möglicht klein zu halten, das heißt einen Chip für ein organisches elektronisches Bauteil zu schaffen mit möglichst hoch aufgelöster Strukturierung.

20

25

30

35

Bekannt sind organische elektronische Bauteile, insbesondere OFETs mit hochaufgelöster Strukturierung und kleinem Source-Drain-Abstand "l". Bislang werden diese jedoch in aufwendigen Prozessschritten, die mit hohen Kosten verbunden sind, hergestellt. Diese Prozessschritte sind unwirtschaftlich und umfassen regelmäßig Fotolithographie, wobei Vertiefungen in einer unteren Schicht oder im Substrat fotolithographisch erzeugt werden, damit eine Leiterbahn mit der erforderlichen Kapazität gebildet werden kann. Diese Vertiefungen sind muldenförmig und haben keine scharfen Konturen. Der Boden dieser Vertiefungen bleibt unverändert.

Aus der DE 10061297.0 ist zwar ein großtechnisch anwendbares hochauflösendes Druckverfahren bekannt, bei dem die Leiterbahnen in Vertiefungen eingebracht werden, jedoch hat das den Nachteil, dass die Vertiefungen, die durch Aufdrücken eines Prägestempels entstehen, keine steilen Wandflächen und scharf

2

gezogene Kanten haben, sondern mehr muldenförmig und ohne scharfe Konturen ausgebildet sind. Als Folge dieser weichen Übergänge füllt das in die Vertiefung eingebrachte Material nicht akkurat nur die Vertiefung, sondern es verwischt um die Vertiefung herum und führt damit zu Leckströmen. Das verschmierte Material lässt sich in der Folge auch nicht abwischen, ohne einen Großteil des Materials wieder aus der Vertiefung herauszuwischen.

10 Aufgabe der Erfindung ist es, ein großtechnisch und günstig herstellbares elektronisches Bauteil aus vorwiegend organischem Material, insbesondere einen OFET mit einer hochaufgelösten Struktur und einem kleinen Source-Drain-Abstand, zu schaffen.

15

20

5

Lösung der Aufgabe und Gegenstand der Erfindung ist ein elektronisches Bauelement aus vorwiegend organischem Material, ein Substrat, zumindest eine Leiterbahn und/oder Elektrode umfassend, wobei die zumindest eine Leiterbahn und/oder Elektrode aus leitfähigem Material ist und auf einer Auflagefläche aufgebracht ist, deren Oberfläche durch Laserbehandlung modifiziert und/oder aufgeraut ist.

Außerdem ist Gegenstand der Erfindung ein organisches elektronisches Bauteil, bei dem zumindest eine Leiterbahn
und/oder eine Elektrode in einer Vertiefung einer unteren
Schicht angeordnet ist, wobei die Vertiefung mittels eines
Lasers erzeugt wurde das heißt, dass sie steile Wände, scharfe Konturen und eine raue Bodenoberfläche hat.

30

35

25

Schließlich ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauteils, bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder einer Elektrode eine untere Schicht und/oder das Substrat mit einem Laser behandelt wird, so dass zumindest eine Vertiefung und/oder ein modifizierter Bereich in einer unteren Schicht und/oder dem

3

Substrat zu finden ist, wobei die Vertiefung steile Wände, scharfe Konturen und eine raue Oberfläche am Boden hat.

5

10

15

20

25

30

35

Nach einer Ausführungsform der Erfindung ist der Abstand "l" zwischen zwei Elektroden oder zwischen einer Elektrode und einer Leiterbahn kleiner 20µm. Das entspricht einer hohen Auflösung der Strukturierung, die besonders bevorzugt sogar unter 10 µm, insbesondere noch wenigere µm beträgt. Durch die Erfindung werden Leckströme zwischen den Leiterbahnen und/oder Elektroden vermieden und deshalb kann der Abstand "l" dazwischen minimiert werden.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird überschüssiges leitfähiges Material in einem auf die Aufbringung des Materials und/oder die Befüllung der Vertiefungen mit diesem Material folgenden Prozessschritt mechanisch entfernt, also beispielsweise abgewischt, ohne dass dabei leitfähiges Material aus dem aufgerauten Bereich und/oder aus der Vertiefung mit dem aufgerauten Boden in merklichem Umfang wieder entfernt würde.

Das Aufbringen des leitfähigen Materials und/oder die Befüllung der Vertiefungen kann nach verschiedenen Techniken erfolgen: Es kann aufgedampft, aufgesputtert, besprüht, eingerakelt, eingespritzt, beschichtet, bedruckt oder sonst wie erfindungsgemäß aufgebracht und/oder eingefüllt werden.

Nach einer Ausführungsform des Verfahrens wird die untere Schicht und/oder das Substrat mit einem gepulsten Laser, beispielsweise mit Pulslängen von einigen 10 ns, behandelt. Dabei können bereits wenige Pulse ausreichen.

Die durch Laserstrukturierung erzeugten modifizierten und/oder aufgerauten Bereiche und/oder Vertiefungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Auflagefläche für das leitfähige Material mit Laser behandelt wurde. Dadurch unterscheiden sich modifizierte Bereiche und/oder Vertiefungen, die mit La-

4

ser erzeugt werden von den Bereichen und/oder Vertiefungen, die nicht oder beispielsweise durch Einprägen behandelt wurden, wo sich bei letzterem das überflüssige leitfähige Material, das um die Vertiefung herum verteilt ist, nicht ohne große Verluste abwischen lässt.

5

10

25

30

35

Für den Fall, dass die Austrittsarbeit (bezogen auf den Halbleiter) des leitfähigen Materials für das geplante elektronische Bauteil passend ist, wird das überschüssige Material einfach auf den nicht durch Laser veränderten Bereichen der unteren Schicht und/oder des Substrats entfernt, beispielsweise mechanisch (durch Wischen mit Tüchern und/oder einer Gummirolle) und die Strukturierung ist abgeschlossen.

15 Falls die Austrittsarbeit nicht auf den Halbleiter abgestimmt ist, kann zusätzlich z.B. eine schlecht leitende Schicht aufgebracht werden, deren Überschuss ebenfalls mit einer mechanischen Methode wieder entfernt werden kann. Die Kombination dieser beiden leitfähigen Schichten als Elektrode oder als Leiterbahn hat nun eine große Leitfähigkeit und besitzt die passende Austrittsarbeit.

Die Strukturierung der untersten (unteren) leitfähigen Schicht (Schichten) kann zeitlich sofort nach deren Auftragung erfolgen, sie kann auch gleichzeitig mit der Strukturierung der oberen Schichten geschehen.

Die Strukturierung der unteren Schichten kann ebenfalls nachträglich, nach der Strukturierung der oberen leitfähigen Schichten erfolgen (z.B. kann eine obere bereits strukturierte Schicht als Ätzwiderstand dienen).

Der Begriff "leitfähiges Material" soll hier in keiner Weise eingeschränkt werden, da ganz verschiedene Arten von leitfähigen Materialien an der Stelle bereits erfolgreich eingesetzt wurden.

5

Als leitfähiges Material kann beispielsweise ein Metall, eine Legierung, eine Metallpaste oder eine organische leitfähige Verbindung aufgedampft, aufgesputtert oder eingerakelt oder sonst wie aufgebracht werden. Entscheidend ist nur, dass das eingebrachte leitfähige Material auf der vom Laser aufgerauten Oberfläche haftet.

Als bevorzugte Metalle werden Silber, Gold, Aluminium, Kupfer etc. sowie beliebige Mischungen, Legierungen dieser Komponen10 ten genannt, die gasförmig, flüssig, als Tinte oder Metallpaste (Metallpartikel in einem flüssigen Medium) und auch als Feststoff aufgebracht werden können.

Bevorzugte organische Materialien, die sich eben auch mit ei-15 ner unteren leitfähigen Schicht, beispielsweise aus Metall kombinieren lassen, sind PANI, PEDOT und Carbon Black.

"Modifiziert" wird hier gebraucht für Bereiche einer unteren Schicht oder eines Substrats, die durch Laserbehandlung verändert sind.

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand dreier Figuren näher erläutert, die beispielhaft und schematisch wiedergeben, wie im Querschnitt gesehen erfindungsgemäß eine Leiterbahn/Elektrode hergestellt wird.

Bilder A bis C zeigen ein Substrat und/oder eine untere Schicht, die durch ein Verfahren nach der Erfindung behandelt werden:

30

35

25

20

5

A1, B1 und C1 zeigen ein gereinigtes Substrat oder eine gereinigte untere Schicht. Diese wird zunächst durch Laserbehandlung so modifiziert, dass ein Bereich mit einer modifizierten und/oder aufgerauten Oberfläche und/oder eine Vertiefung entsteht (Figuren A2, B2 und C2). Möglich ist auch, dass durch die Behandlung mit Laser eine vorhandene Rauhigkeit der Oberfläche beseitigt wird und der modifizierte Bereich dem-

6

nach eine geringere Rauhigkeit hat als der nicht durch Laserbehandlung modifizierte.

Gemäß den Figuren A2, B2 und C2 ist jedoch die Rauhigkeit der 5 modifizierten Bereiche größer als die der nicht modifizierten.

Im folgenden Prozessschritt A3, B3 und C3 wird großflächig leitfähiges Material aufgebracht.

10

Danach wird das überschüssige Material entfernt, es bilden sich bevorzugt scharf abgezeichnete Bereiche in denen leitfähiges Material ein- und/oder aufgebracht ist und andere, die frei von leitfähigem Material sind siehe Figur A4.

15

Gemäß der Ausführungsform B wird im Prozessschritt B4 auf die noch unstrukturierte hochleitfähige, beispielsweise metallische Schicht noch eine weitere leitfähige Schicht, beispielsweise aus organischem Material oder Funktionspolymer aufgebracht (Y). Diese kann nun mechanisch entfernt werden (B5). 20 Falls die hochleitfähige Schicht nicht mechanisch entfernt (strukturiert) werden kann, wird nach dem Prozessschritt B5 eine andersartige (z.B. chemische) Methode gewählt, um die hochleitfähige Schicht zu strukturieren. Die hochleitfähige Schicht (x) wird an den "modifizierten" oder aufgerauten 25 Stellen bedeckt und kann hier nicht entfernt werden (B5). Nach der chemischen Strukturierung (z.B. ein Ätzprozess) liegt in (B6) die Kombination der hochleitfähigen (beispielsweise metallischen) und der leitfähigen (beispielsweise polymeren) Schicht in strukturierter Form vor. 30

Bei C4 wird ebenfalls eine weitere leitfähige Schicht aufgebracht und anschließend werden beide leitfähigen Schichten mechanische strukturiert (C5).

35

Mit dem Prozess nach der Erfindung können leitfähige Strukturen hergestellt werden, die:

7

- aus mehreren Schichten (versch. Leitfähigkeit) bestehen um z.B. die passende Austrittsarbeit zu gewährleisten.

- hochleitfähig bzw. im "Paket" hochleitfähig sind.
- 5 kostengünstig sind, da nur wenige (3,4,5) Prozessschritte benötigt werden.
  - die benötigte Auflösung haben (möglichst kleine Struktur)
  - die auf einem massenfertigungstauglichen und schnellen Prozess basieren.

.10

15

20

25

30

35

Die Vorteile liegen auch in der einfachen Herstellungsmethode da nur 3 Prozessschritte benötigt werden (z.B. Laserstrukturierung , leitfähige Schicht aufbringen, Strukturierung der leitfähigen Schicht). Beispielsweise können durch die Verwendung von metallischen Leitern (fest oder flüssig) wiederum beispielsweise in Kombination mit weiteren Leitern aus organischem Material sehr hoch leitfähige kleine Strukturen erstellt werden, ohne das ein Spannungsabfall in den Leiterbahnen problematisch wird. Zusätzlich kann die Austrittsarbeit angepasst werden. Mit Verwendung dieser Technik kann die Schaltungsgröße minimiert werden, wodurch sich ebenfalls die Kosten in gleichem Maße reduzieren.

Das Substrat wird beispielsweise im Rolle-zu-Rolle-Verfahren zwischen mehreren Walzen hindurchgezogen. Im ersten Arbeitsgang werden dann mit einem Laser, beispielsweise einem Excimer-Laser, durch eine Maske Vertiefungen und/oder modifizierte oder aufgeraute Bereiche im Substrat oder einer unteren Schicht erzeugt. Der Excimer-Laser ist gegebenenfalls mit optischen Linsensystemen ausgestattet, so dass die Vertiefungen/Bereiche nicht unbedingt in derselben Größe abgebildet werden wie die Maske sie vorgibt.

Bei der mechanischen Strukturierung wird eventuell vorhandenes leitfähiges Material zwischen den Vertiefungen/Bereichen beispielsweise mit einer saugfähigen Rolle im roll-to-roll

8

Verfahren entfernt. Die Rolle dreht sich beispielsweise langsamer als die anderen Rollen, so dass effektiv gewischt wird.

Der Begriff "organisches Material" oder "Funktionsmaterial" oder "(Funktions-)Polymer" umfasst hier alle Arten von organischen, metallorganischen und/oder organisch-anorganischen Kunststoffen (Hybride), insbesondere die, die im Englischen z.B. mit "plastics" bezeichnet werden. Es handelt sich um alle Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die klassischen Dioden bilden (Germanium, Silizium). Eine Be-10 schränkung im dogmatischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. Weiterhin soll der Term keiner Beschränkung im Hinblick auf die Molekülgröße, insbesondere auf polymere 15 und/oder oligomere Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der Einsatz von "small molecules" möglich. Der Wortbestandteil "polymer" im Funktionspolymer ist historisch bedingt und enthält insofern keine Aussage über das Vorliegen einer tatsächlich polymeren Verbindung. 20

Durch die Erfindung wird erstmals ein Verfahren vorgestellt, mit dem ein organisches elektronisches Bauelement wie ein OFET, der durchaus auch metallische Komponenten und Schichten umfassen kann, mit hoher Schaltgeschwindigkeit und hoher Zuverlässigkeit wirtschaftlich hergestellt werden kann. Es hat sich gezeigt, dass Vertiefungen und/oder Bereiche, die mit einem Laser hergestellt werden, die Aufbringung von leitfähigem organischen Material anders halten als die herkömmlichen Vertiefungen/Strukturierungen und, dass deshalb mit dieser Methode Leiterbahnen organische und metallischer Natur schneller und besser herstellbar sind als nach anderen Methoden.

25

9

#### Patentansprüche

15

20

1. Elektronisches Bauelement aus vorwiegend organischem Material, ein Substrat, zumindest eine Leiterbahn und/oder Elektrode umfassend, wobei die zumindest eine Leiterbahn und/oder Elektrode aus leitfähigem Material ist und auf einer Auflagefläche aufgebracht ist, deren Oberfläche durch Laserbehandlung modifiziert und/oder aufgeraut ist.

2. Elektronisches Bauteil bei dem zumindest eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode in einer Vertiefung einer unteren Schicht angeordnet ist, wobei die Vertiefung mittels eines Lasers erzeugt wurde, das heißt, dass sie steile Wände, scharfe Konturen und eine relativ raue Bodenoberfläche hat.

3. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit einem Abstand l zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10um.

- 4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit zumindest einer Leiterbahn und/oder Elektrode aus Metall oder einer Legierung.
- 5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit zumindest einer Leiterbahn und/oder Elektrode, die aus einem Metall in Kombination mit einer Schicht aus organischem Material ist.
- 30 6. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder einer Elektrode eine untere Schicht und/oder das Substrat mit einem Laser behandelt wird, so dass zumindest eine Vertiefung und/oder ein modifizierter Bereich in einer unteren Schicht
- 35 und/oder dem Substrat zu finden ist.

10

- 7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die leitfähige Schicht mechanisch strukturiert wird.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, bei dem überflüssiges leitfähiges Material in einem auf das Aufbringen
  der Schicht aus diesem Material folgenden Prozessschritt abgewischt wird.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei dem ein gepulster Laser, beispielsweise ein Excimer-Laser eingesetzt wird.

15

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, das in einem kontinuierlichen roll-to-roll Prozess durchgeführt wird.

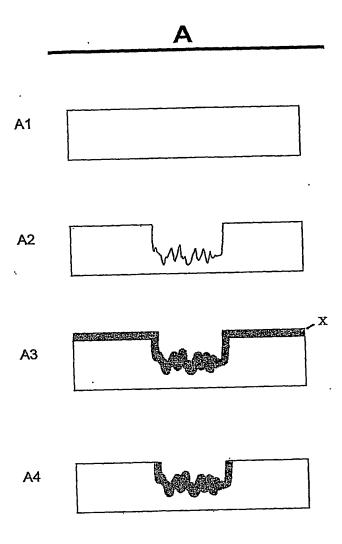


FIG.1

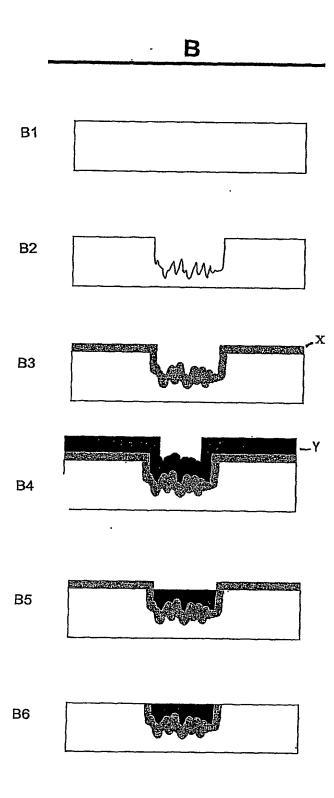


FIG. 2
ERSATZBLATT

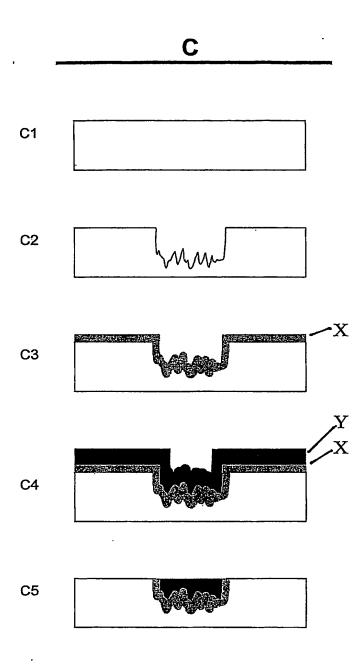


FIG.3

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermediation No PCT/DE2004/001816

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	Relevant to claim No.	
L,P, X	WO 2004/042837 A (MANUELLI ALE FIX WALTER (DE); SIEMENS AG (D ANDREA) 21 May 2004 (2004-05-2 L: Priorität the whole document	1-10	
Y	WO 02/47183 A (KURZ HEINRICH; ADOLF (DE); HARING PETER (DE); (DE);) 13 June 2002 (2002-06-1 the whole document	1-10	
Y	EP 0 966 182 A (LG ELECTRONICS 22 December 1999 (1999-12-22) the whole document	1-10	
Y	US 5 994 773 A (HIRAKAWA TADAS 30 November 1999 (1999-11-30) column 4, line 11 - line 25	SHI)	1-10
		-/	
X Fu	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docum cons "E" earliei filing "L" docum whic	nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance recument but published on or after the international date nent which may throw doubts on priority claim(s) or h is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"T" later document published after the int or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention.  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the d'  "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in-	n the application but neory underlying the claimed invention at be considered to ocument is taken alone claimed invention
"O" docur	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means nent published prior to the international filing date but	ous to a person skilled	

Name and mailing address of the ISA

1

document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

Ruropean Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Date of the actual completion of the international search

11 November 2004

"&" document member of the same patent family

29/11/2004

Wolfbauer, G

Authorized officer

Date of malling of the international search report

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interest nal Application No PCT/DE2004/001816

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2002/170897 A1 (HALL FRANK L) 21 November 2002 (2002-11-21) page 2, column 2, paragraph 1 page 4, column 2, paragraph 1	1-10
A	EP 1 237 207 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 4 September 2002 (2002-09-04) the whole document	10
-		

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

Internation Application No
PCT/DE2004/001816

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO	2004042837	Α	21-05-2004	WO	2004042837	A2	21-05-2004
WO	0247183	A	13-06-2002	DE WO EP JP US	10061297 0247183 1346422 2004515928 2004063267	A1 A1 T	27-06-2002 13-06-2002 24-09-2003 27-05-2004 01-04-2004
EP	0966182	A	22-12-1999	KR CN EP JP US	2000002154 1239395 0966182 2000012220 6146715	A A1 A	15-01-2000 22-12-1999 22-12-1999 14-01-2000 14-11-2000
US	5994773	Α	30-11-1999	JP JP	3080579 9246418		28-08-2000 19-09-1997
US	2002170897	A1	21-11-2002	US US US	2004104206 2004169024 2004170915	<b>A</b> 1	03-06-2004 02-09-2004 02-09-2004
EP	1237207	Α _	04-09-2002	JP JP EP US	2002260854 2002260855 1237207 2002127877	A A2	13-09-2002 13-09-2002 04-09-2002 12-09-2002

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

pnales Aktenzeichen PCT/DE2004/001816

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.	
L,P, X	WO 2004/042837 A (MANUELLI ALESSANDRO ; FIX WALTER (DE); SIEMENS AG (DE); ULLMANN ANDREA) 21. Mai 2004 (2004-05-21) L: Priorität das ganze Dokument	1-10	
Υ	WO 02/47183 A (KURZ HEINRICH; BERNDS ADOLF (DE); HARING PETER (DE); SIEMENS AG (DE);) 13. Juni 2002 (2002-06-13) das ganze Dokument	1-10	
Y	EP 0 966 182 A (LG ELECTRONICS INC) 22. Dezember 1999 (1999-12-22) das ganze Dokument	1-10	
Υ	US 5 994 773 A (HIRAKAWA TADASHI) 30. November 1999 (1999-11-30) Spalte 4, Zeile 11 - Zeile 25	1-10	

1	
Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>*E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>*L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>*O* Veröffentlichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Mai\u00e4nahmen bezieht</li> <li>*P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorif\u00e4stadum ver\u00fcffentlicht worden ist</li> </ul>	<ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist</li> <li>"X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>"Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>"&amp;' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
11. November 2004	29/11/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31–70) 340–3016	Wolfbauer, G

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intermonales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001816

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	In-
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 2002/170897 A1 (HALL FRANK L) 21. November 2002 (2002-11-21) Seite 2, Spalte 2, Absatz 1 Seite 4, Spalte 2, Absatz 1	1-10
A	EP 1 237 207 A (FUJI PHOTO FILM CO LTD) 4. September 2002 (2002-09-04) das ganze Dokument	10

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichut, die zur selben Patentfamilie gehören

nales Aklenzaichen PCT/DE2004/001816

Im R angefüh	echerchenbericht rtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO	2004042837	A	21-05-2004	WO	2004042837 A	2	21-05-2004
WO	0247183	Α	13-06-2002	DE WO EP JP US	10061297 A 0247183 A 1346422 A 2004515928 T 2004063267 A	1 1	27-06-2002 13-06-2002 24-09-2003 27-05-2004 01-04-2004
EP	0966182	Α	22-12-1999	KR CN EP JP US	2000002154 A 1239395 A 0966182 A 2000012220 A 6146715 A	1	15-01-2000 22-12-1999 22-12-1999 14-01-2000 14-11-2000
US	5994773	Α	30-11-1999	JP JP	3080579 B 9246418 A		28-08-2000 19-09-1997
US	2002170897	A1	21-11-2002	US US US	2004104206 A 2004169024 A 2004170915 A	1	03-06-2004 02-09-2004 02-09-2004
EP	1237207	Α	04-09-2002	JP JP EP US	2002260854 A 2002260855 A 1237207 A 2002127877 A	4 42	13-09-2002 13-09-2002 04-09-2002 12-09-2002